ЛАЗЕРЫ

PACS 42.55.Px; 41.75.Fr; 42.60.Jf

Лазерное излучение мишеней газового диода из соединений CdS_xSe_{1-x}

А.С.Насибов, К.В.Бережной, М.Б.Бочкарев, А.Г.Садыкова, П.В.Шапкин, С.А.Шунайлов

Исследовано лазерное излучение полупроводниковых мишеней (ПМ) из твердых растворов CdS_xSe_{1-x} , возбуждаемых электронным пучком (ЭП) в газовом диоде (ГД) при постоянном и изменяющемся давлении газа. В первом случае генерация возбуждалась ЭП с энергией 170 кэВ и длительностью 100 пс в ПМ с различным значением х. Максимальная мощность 125 и 96 кВт достигалась соответственно при $x \approx 0.2$ ($\lambda \approx 677$ нм) и $x \approx 1$ ($\lambda \approx 522$ нм). Наименьшая мощность (26 кВт) наблюдалась в желто-зеленой области спектра. Максимальная дифференциальная эффективность в этих экспериментах достигала 9%. Во-втором случае исследована зависимость мощности излучения ПМ из CdS (x = 1) при изменении давления воздуха в ГД от 0.1 до 2.5 Тор. Экспериментальные данные хорошо согласуются с результатами расчетов. Продемонстрирована возможность улучшения расходимости излучения применения оптического волокна с увеличивающемся диаметром. На пороге генерации ПМ при возбуждении ЭП или стримерным разрядом возникали нитевидные каналы, причиной образования которых, возможно, является анизотропия коэффициента ударной ионизации.

Ключевые слова: полупроводниковая лазерная мишень, газовый диод, электронный пучок.

1. Введение

При возбуждении полупроводниковых лазеров электронным пучком или электрическим полем могут формироваться мощные (10⁴-10⁶ Вт) импульсы лазерного излучения в видимой и УФ областях спектра. Особый интерес представляет исследование возможностей формирования пикосекундных импульсов, используемых в медицине и при исследовании быстропротекающих процессов в биологических тканях и регистрирующих приборах. Появление методов формирования УКИ высокого напряжения [1] создало предпосылки для дальнейшего развития таких лазеров [2-6]. В отличие от ранних работ [7,8], в наших экспериментах лазерная полупроводниковая мишень (ПМ) устанавливается между электродами в заполненной газом металлической камере, согласованной с генератором наносекундных импульсов. Коаксиальная конструкция камеры обеспечивает высокую скорость нарастания напряжения ($dU/dt > 10^{13}$ B/c). Камеру такого типа называют газовым диодом (ГД) и обычно применяют для исследования высоковольтных наносекундных газовых разрядов. Нами исследуется возможность применения ГД для формирования импульсов лазерного излучения в пикосекундном диапазоне при возбуждении ПМ электрическим разрядом и электронным пучком (ЭП).

Из результатов, полученных за последнее время, следует отметить генерацию лазерного излучения на нескольких спектральных линиях при использовании в качестве активной среды твердых полупроводниковых растворов $Cd_xZn_{1-x}S$ и CdS_xSe_{1-x} [9, 10]. В ГД на первой стадии развития наносекундного разряда даже при атмосферном давлении газа наблюдаются ускоренные электроны, которые получили название убегающих [11]. В работе [12] показано, что, изменяя давление газа (воздух) от 0.1 до 2 Тор в ГД с ПМ из сульфида кадмия, можно варьировать длительность лазерного излучения от 125 до 20 пс.

Для измерения спектральных и динамических характеристик ПМ в настоящей работе, в отличие от [6], где использовалась установка с высоковольтной линией задержки, применена волоконно-оптическая система синхронизации и регистрации. Основной целью экспериментов являлось получение мощных пикосекундных импульсов лазерного излучения в красно-зеленом диапазоне спектра при использовании в качестве мишеней полупроводниковых твердых растворов CdS_xSe_{1-x} с различным значением *x*. Исследования проводились при постоянном давлении газа и при его изменении от 0.1 до 2.5 Тор.

2. Техника и результаты экспериментов

Схема экспериментальной установки с волоконно-оптической системой регистрации излучения представлена на рис.1. Система позволяет проводить пикосекундную диагностику излучательных процессов в реальном масштабе времени. Работа генератора пикосекундных импульсов высокого напряжения (ГИН) основана на принципе обострения фронта и уменьшении длительности импульса, сформированного генератором РАДАН-303 *I*, путем последовательного включения разрядников высокого давления (~10 ат) и срезающего кольцевого слайсера *2*. Для измерения параметров импульса напряжения в передающую линию ГИНа встроен емкостный делитель напряжения *3*. Дополнительный разрядник *4* служит для

А.С.Насибов, К.В.Бережной, П.В. Шапкин. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53; e-mail: nas2121@mail.ru

М.Б.Бочкарев, А.Г.Садыкова, С.А.Шунайлов. Институт электрофизики УрО РАН, Россия, 620016 Екатеринбург, ул. Амундсена, 106

Поступила в редакцию 25 ноября 2013 г., после доработки – 2 декабря 2013 г.



Рис.1. Схема экспериментальной установки с волоконно-оптической системой синхронизации и регистрации:

1 – импульсный генератор РАДАН-303; 2 – срезающий разрядник (слайсер); 3 – делитель напряжения; 4 – дополнительный разрядник; 5 – фокусирующая насадка; 6 – газовая камера; 7 – полупроводниковая мишень; 8 – ФЭК; 9 – пятиканальная волоконно-оптическая система; 10 – коаксиальный кабель для запуска стриккамеры; 11 – стрик-камера; 12 – персональный компьютер.

синхронизации ГИНа с регистрирующей аппаратурой. Для регистрации спектров и динамики излучения в камере ГД установлены волоконно-оптические кабели (ВОК) с коннекторами 5, в которых находятся микролинзы, фокусирующие излучение на входные концы кабеля. После пробоя разрядного промежутка 4 импульс высокого напряжения (до 200 кВ) отрицательной полярности поступает на катодный электрод 6, работающий в режиме взрывной эмиссии. Диаметр ЭП на мишени 7 ограничен диафрагмой (Ø1 мм). Подробное описание ГИНа приведено в работе [5].

ПМ изготовлены из монокристаллических пленок CdS_xSe_{1-x} толщиной 20–30 мкм, закрепленных на сапфировых дисках 7. На обе поверхности пленок нанесены отражающие покрытия ($R_1R_2 \approx 0.88$), образующие оптический резонатор. Для наблюдения динамики и формы светового импульса применялась стрик-камера 11 (модель 173, CORDIN). Синхронизация стрик-камеры с ГИНом осуществлялась с помощью приемника ФЭК-22М 8. Время задержки регулировалось длиной оптического кабеля пятиканальной системы 9. Форма импульсов регистрировалась также широкополосным приемником ФП-70С с волоконным кабелем с коннектором 5 (длительность переходной характеристики ФП-70С составляла ~100 пс). Ток электронного пучка измерялся широкополосным цилиндром Фарадея, который устанавливался за отверстием в диафрагме напротив катода 6. Для измерения энергии лазерных импульсов применялись пироэлектрический детектор J3S10 и ослабляющие фильтры HC. Пиковая мощность излучения оценивалась с учетом формы импульса. Для регистрации импульсов напряжения, тока и излучения использовался осциллограф Tektronix TDS-6154C с полосой 15 ГГц. Длительность и энергия ЭП предварительно задавались слайсером и затем могли регулироваться путем изменения давления воздуха в камере ГД. Спектр излучения регистрировался малогабаритным спектрометром ФСД-8.

Большинство экспериментов проводилось при давлении воздуха в ГД 0.5–1 Тор. В этом диапазоне давлений амплитуда тока ЭП была наиболее стабильна. При длительности импульса напряжения $t_p > 500$ пс на вершине импульса тока наблюдались два пичка, амплитуды кото-



Рис.2. Зависимость амплитуды пичков A_1 и A_2 импульса тока от давления воздуха в ГД.

рых A_1 и A_2 изменялись в зависимости от давления в ГД (рис.2). Осциллограммы импульсов напряжения и тока ЭП при различных длительностях t_p и давлениях воздуха в камере ГД приведены на рис.3.

Зависимость длины волны лазерного изучения от параметра x для ПМ из монокристаллов CdS_ySe_{1-x}, выращенных методом пересублимации из газовой фазы [13], показана на рис.4. Прямая соединяет точки, соответствующие длинам волн бинарных соединений CdSe (x = 0) и CdS (*x* = 1). Полученные экспериментальные результаты согласуются с данным справочника по полупроводниковым твердым растворам [14]. Всего было исследовано 12 образцов ПМ с различным значением x, на которых была получена генерация лазерного излучения в диапазоне 522-677 нм, что соответствует изменению x от 1 до 0.2. Зависимость мощности излучения от длины волны приведена на рис.5. Мощность излучения при вариации состава изменялась немонотонно и заметно снижалась при x = 0.7 - 0.8 в желто-зеленой области спектра. Наибольшие мощности (96 и 125 кВт) при лазерной эффективности по вложенной мощности 4.8% и 6% были получены при *x* = 1 $(\lambda = 522 \text{ нм})$ и $x \approx 0.2$ ($\lambda = 677 \text{ нм}$), когда ПМ по составу был близок к бинарным соединениям CdS и CdSe. В желто-зеленой области спектра эффективность излучения уменьшалась до 1.3%. Эта серия экспериментов проводилась при напряжении –170 кВ и токе ЭП 12 А. Пороговая плотность мощности тока ЭП $p_{\rm th}$ при длительности импульса $t_e = 135$ пс равнялась 8.5×10^7 Вт/см², что примерно на порядок больше значения 10^7 Bt/cm², полученного в работе [15] при длительности $t_e = 4$ нс в условиях, близких к условиям наших экспериментов.

Типичные спектры генерации ПМ при x = 1 и 0.2 приведены на рис.6. На рис.7 показана зависимость мощности излучения ПМ ($x \approx 1$, $\lambda = 522$ нм) от давления воздуха в ГД. Видно, что при изменении давления от 0.1 до 1 Тор мощность излучения практический не меняется, а затем с ростом давления монотонно снижается до уровня 0.6 P_{max}. Такое ее изменение объясняется нелинейной зависимостью амплитуды и длительности импульса тока от давления газа в ГД [16]. Учет этих факторов приводит к хорошему совпадению экспериментальных и расчетных данных (рис.7). Для возбуждения генерации в этих экспериментах устанавливалось исходное напряжение -150 кВ. Мощность излучения достигала 30 и 15 кВт при длительности импульса тока ЭП на полувысоте 125 и 80 пс, а эффективность составляла ~5%. На рис.8 показаны типичные импульсы лазерного излучения, зарегистрированные



Рис.3. Осциллограммы импульсов напряжения U и тока I ЭП при U = -150 кВ и следующих параметрах: $I_{max} = 4$ A, p = 0.6 Тор (*a*), 3.5 A, 0.76 Тор (*б*) и 4 A, 0.58 Тор (*в*).



Рис.4. Зависимость длины волны от параметра x для ПМ из монокристаллов CdS_xSe_{1-x} толщиной 30 мкм.

в процессе проведения данных экспериментов широкополосным фотоприемником ФП-70С и стрик-камерой при различных давлениях газа в ГД.



Рис.5. Зависимость мощности излучения от длины волны для ПМ из CdS_xSe_{1-x} .



Рис.6. Спектры генерации ПМ из CdS_xSe_{1-x} при x = 1 (*a*) и 0.2 (*б*).



Рис.7. Зависимости мощности излучения ПМ из CdS от давления газа при U = -150 кB, $t_e = 125-80 \text{ пс}$, $\tau_0 = 1.5 \text{ нс}$.

Расходимость излучения ПМ не превышала 15°. Обычно для уменьшения расходимости применяют внешний резонатор [17]. Эффективность лазера в этом случае уменьшается с длиной резонатора как $1/L^2$ [15]. Для уменьшения расходимости мы использовали оптическое волокно с увеличивающимся диаметром (фокон) длиной 5 см и с отношением входного и выходного диаметров 0.5. Входная плоскость фокона (с меньшим диаметром) устанавливалась на сапфировой подложке ПМ. Изображение ближней зоны на выходной плоскости фокона увеличивалось в диаметре в два раза, а угол расходимости уменьшался до 6–7°, при этом эффективность лазера практически не изменялась.

На рис.9 приведены снимки ближней зоны излучения ПМ из CdS_xSe_{1-x} (x = 0.2, $\lambda = 677$ нм) в режиме возбуждения пучком электронов (рис.9,a-e), а также излучения ПМ из CdS_xSe_{1-x} (x = 0.7, $\lambda = 572$ нм) при возбуждении



Рис.8. Импульсы лазерного излучения, зарегистрированные стриккамерой (*a*) и фотоприемником $\Phi\Pi$ -70С (*б*) при различных давлениях газа в ГД.

стримерным разрядом (рис.9,*г*). Снимок на рис.9,*а* выполнен на пороге генерации, снимки на рис.9,*б*,*в* – при превышении порога, а снимок на рис.9,*г* – при возбуждении стримерной генерации в плоскопараллельной пластине толщиной 1 мм импульсом напряжения с амплитудой 100 кВ. Интересно, что во всех случаях генерация развивается в отдельных точках, число и диаметр которых увеличиваются по мере роста мощности возбуждающего импульса.

3. Обсуждение результатов

Для объяснения наблюдаемых явлений рассмотрим основные формулы зависимости мощности $P_{\rm las}$ лазерного излучения от параметров оптического резонатора и электронного пучка [7, 18, 19]:

$$P_{\rm las} = k\beta_{\rm in} f P_{\rm p} \left(1 - \frac{I_{\rm th}}{I_{\rm p}} \right), \tag{1}$$

$$f = \left[1 + \frac{2\alpha_{\rm ex} z_{\rm ex}}{\ln|R_1 R_2|} + \frac{2\alpha_{\rm pas}(h - z_{\rm ex})}{\ln|R_1 R_2|}\right]^{-1},\tag{2}$$

$$I_{\rm th} = I_{\rm th0} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_{\rm e}}{\tau_0}\right) \right]^{-1},\tag{3}$$

где $k \approx 0.1 - 0.2$ – коэффициент, характеризирующий потери энергии на ионизацию и обратное рассеяние при возбуждении электронным пучком; β_{in} – внутренняя квантовая эффективность; *f* – функция выхода излучения; *P*_p – импульсная мощность ЭП; I_p – ток ЭП; I_{th}-пороговый ток ЭП; $I_{\rm th0}$ – пороговый ток при $\tau_0 \gg t_{\rm e}; \tau_0$ – время жизни неравновесных носителей заряда; $\alpha_{ex} \approx 2-3 \text{ см}^{-1}$ – коэффициент поглощения излучения в возбужденной области ПМ; $\alpha_{\rm nas} \approx 30 \,{\rm cm}^{-1}$ – коэффициент поглощения излучения в пассивной области; $z_{ex} \approx \mu_1 E_e$ – длина возбужденной области; h – толщина полупроводниковой пластины; R₁ и R_2 – коэффициенты отражения зеркал; E_e – энергия ЭП. В случае CdS (x = 1) $\mu_1 = 0.16$ мкм/кэВ. Как уже отмечалось, в нашем случае при длительности импульса ЭП на полувысоте $t_{\rm e} = 125$ пс пороговая плотность мощности ЭП $p_{\rm th} \approx$ 10^8 Вт/см². Время жизни τ_0 для CdS и CdSSe при T = 300 К составляет 1–3 нс [19]. Подставив в (3) $t_e = 1.25 \times 10^{-10}$ с и $\tau_0 = 1.5 \times 10^{-9}$ с, получим $I_{\rm th}/I_0 \approx 12$, т. е. при длительности импульса в сотни пикосекунд порог генерации может увеличиться более чем на порядок, что хорошо соответствует данным работы [15] ($p_{th0} = 10^7 \text{ Вт/см}^2$ при $t_e = 4 \text{ нс}$).

Рассмотрим теперь зависимость мощности излучения от длины волны (см. рис.5). Для $\lambda = 677$ нм (CdS_xSe_{1-x}, $x \approx 0.2$) и $\lambda = 522$ нм (CdS, $x \approx 1$) отношение $P_{las0.2}/P_{las1} \approx$ 1.3, а $\lambda_{0.2}/\lambda_1 = 1.29$; таким образом, при приближении материала ПМ к бинарным соединениям CdS и CdSe, идентичных параметрах лазера (h = 30 мкм, $R_1R_2 = 0.88$) и возбуждении генерации одним и тем же ЭП излучаемая мощность растет с увеличением длины волны (с уменьшением ширины энергетической зоны). Такая зависимость следует из рассмотрения уравнений (1) и (2).

Оценим мощность излучения, использовав формулы (1)–(3) и следующие значения входящих в них параметров: $k \approx 0.12$, $\beta_{in} = 1$, h = 30 мкм, $R_1R_2 = 0.88$, f = 0.8, $\alpha_{ex} \approx 2.5$ см⁻¹, $\alpha_{pas} \approx 30$ см⁻¹, $z_{ex} = 27$ мкм, U = -170 кВ, $P_p = 2 \times 10^6$ Вт, $I_{th0.2} = 4$ А, $I_p = 12$ А. Подставляя эти данные в (1), получаем $P_{las} \approx 129$ кВт, что хорошо соответствует экспериментальному результату 125 кВт и говорит о высоком качестве соединений, близких к бинарным (последнее подтверждается и тем, что $P_{las0.2}/P_{las1} \approx \lambda_{0.2}/\lambda_1$). Дифференциальная эффективность для рассмотренного случая составляет ~9%. Увеличение порога генерации в желто-зеленой области спектра наблюдалось также в работе [20], авторами которой было высказано предположение, что одной из причин этого является склонность твердых растворов, полученных при высокой температуре, в процессе охлаждения расслаиваться на фазы, близкие по составу к бинарным соединениям. Это предположение косвенно под-



Рис.9. Картины ближней зоны генерации ПМ из CdS_xSe_{1-x} ($x \approx 0.2$, $\lambda = 677$ нм) при последовательном увеличении тока $\exists \Pi (a-e)$ и возбуждении стримерным разрядом ($x \approx 0.7$, $\lambda = 572$ нм) (ϵ). Генерирующие области состоят из отдельных точек диаметром в десятки микрометров, плохо разрешимых на фотографиях.

тверждается нашими экспериментами с возбуждением разрядом, когда при движении стримерного разряда в монокристаллах твердых растворов наряду с основной линией спектра наблюдаются и линии, близкие к длинам волн для бинарных соединений [9,10]. В этом случае одним из путей увеличения эффективности генерации ПМ, по-видимому, является уменьшение толщины пленки до 10–15 мкм. Однако изготовление таких мишеней связано с рядом технологических трудностей.

Рассмотрим теперь результаты исследования зависимости мощности и длительности лазерного излучения ПМ от давления в камере ГД. С увеличением давления воздуха в ГД от 0.1 до ~1 Тор амплитуды импульсов тока и напряжения изменяются незначительно, хотя их длительности сокращаются со стороны среза; также незначительно изменяется мощность лазерного излучения (см. рис.7). Этот процесс связан с увеличением проводимости ГД и уменьшением времени пробоя промежутка катодмишень. С увеличением давления газа пробой промежутка происходит на фронте импульса напряжения и соответственно уменьшаются амплитуды и длительности импульсов напряжения и тока (в нашем случае длительность импульса тока на полувысоте изменялась от 125 до 80 пс). Уменьшение тока и длительности возбуждающего ЭП при изменении давления от 1 до 2.5 Тор приводит к уменьшению длительности и мощности излучения (с 30 до 15 кВт). Расчеты зависимости мощности излучения от давления воздуха в ГД (рис.7) с учетом изменения мощности возбуждающего ЭП и зависимости порога генерации от длительности импульса (4) хорошо совпадают с экспериментальными данными.

Представляют интерес картины ближней зоны генерации CdSSe при возбуждении ЭП и стримерным разрядом (рис.9). Возникновение каналов генерации в виде ярко светящихся точек диаметром в единицы-десятки микрометров, в которых возникают благоприятные условия для начала генерации, было замечено давно [21], однако до сих пор не нашло убедительного объяснения. Сходство картин при возбуждении ЭП или разрядом позволяет предположить, что причиной образования точек является анизотропия коэффициентов ударной ионизации, которая приводит к образованию каналов и распространению стримера в определенном кристаллографическом направлении [22,23].

Таким образом, нами продемонстрирована возможность получения на полупроводниковых мишенях газового диода при изменении давления от 0.1до 2.5 Тор генерации лазерного излучения в видимой области спектра (500–700 нм) длительностью от 1 нс до 100 пс и мощностью в десятки-сотни киловатт. Падение эффективности генерации в желто-зеленой части спектра связано, по-видимому, с неоднородностью твердых растворов и может быть компенсировано путем оптимизации параметров резонатора и улучшения качества кристаллов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-08-00263-а).

- 1. Месяц Г.А., Яландин М.И. УФН, **175** (3), 225 (2005).
- Месяц Г.А., Насибов А.С., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. ЖЭТФ, 133 (6), 1162 (2008).
- Месяц Г.А., Насибов А.С., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. Квантовая электроника, 38 (3), 213 (2008).
- Бережной К.А., Насибов А.С., Шапкин П.В., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. Квантовая электроника, 38 (9), 829 (2008).
- 5. Насибов А.С., Бережной К.В., Шапкин П.В. Реутова А.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. ПТЭ, № 1, 75 (2009).
- Бережной К.В., Бочкарев М.Б., Насибов А.С., Реутова А.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. ПТЭ, № 2, 124 (2010).
- Богданкевич О.В., Дарзнек С.А., Елисеев П.Г. Полупроводниковые лазеры (М.: Наука, 1976).
- Крюкова И.В. Физические процессы в полупроводниковых импульсных лазерах с накачкой электронными пучками (М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009).
- Насибов А.С., Даниелян Г.Д., Баграмов В.Г., Бережной К.В. Кр. сообщ. физ. ФИАН, № 4, 17 (2011).
- Насибов А.С., Баграмов В.Г., Бережной К.В., Шапкин П.В. Кр. сообщ. физ. ФИАН, № 4, 25 (2013).
- Тарасенко В.Ф., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И., Орловский В.М., Алексеев С.В. Письма в ЖТФ, 29 (21), 1 (2003).
- Бережной К.В., Бочкарев М.Б., Даниелян Г.Л., Насибов А.С., Реутова А.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. Квантовая электроника, 42 (1), 34 (2012).
- Korostelin Yu.V., Kozlovsky V.I., Nasibov A.S., Shapkin P.V. J. Cryst. Growth, 161, 51 (1996).
- Берченко Н.И., Кревс В.Е, Средин В.Г. Полупроводниковые твердые растворы и их применение (М.: Воениздат, 1982).
- Daneu V., DeGloria D.P., SanchezA., Osgood R.M. Appl. Phys. Lett., 49 (10), 8 (1986).
- Насибов А.С., Бережной К.В., Бочкарев М.Б., Даниелян Г.Л., Реутова А.Г., Шунайлов С.А. Докл. 20-й Межд. конф. «Лазеры, измерения, информация» (СПб.: изд-во ГПУ, 2010, т. 1, с. 5).
- Басов Н.Г., Богданкевич О.В., Печенов А.Н., Насибов А.С., Федосеев К.П. ЖЭТФ, 55, 1710 (1969).
- Богданкевич О.В., Зверев М.М., Красавина Е.М. и др. Квантовая электроника, 14 (3), 218 (1987).
- Козловский В.И., Попов Ю.М. Квантовая электроника, 33 (1), 48 (2003).
- Ахекян А.М., Козловский В.И., Коростелин Ю.В., Резников П.В., Тихонов В.Г., Шапкин П.В. *Труды ФИАН*, 202, 128 (1991).
- Козловский В.И., Насибов А.С., Печенов А.Н. Квантовая электроника, 4 (2), 351 (1977).
- 22. Басов Н.Г., Молчанов А.Г., Насибов А.С., Обидин А.З., Печенов А.Н., Попов Ю.М. ЖЭТФ, **70** (5), 1751 (1976).
- Обидин А.З., Печенов А.Н., Попов Ю.М., Фролов В.А., Насибов А.С. Квантовая электроника, 9 (8), 1530 (1982).